Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> eBook Umum 1

Judul:
Accelerated Testing Statistical Models, Test Plans,and Data Analyses
Pengarang/Penulis:
WAYNE NELSON
Subjek:
16756
Nomor Panggil:
ebook-4478-2010
Penerbit:
John Wiley & Sons, Inc.
Tahun:

Link Terkait:
- Deskripsi Bibliografi: https://library.stik-ptik.ac.id/opac/koleksi/41847
- Abstrak: https://library.stik-ptik.ac.id/opac/koleksi/41847/abstrak
- Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK): https://library.stik-ptik.ac.id/opac